Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Platina de tracción y calentamiento in situ a microescala B2-01-35-150-7009

Código: B2-01-35-150-7009

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Platina de tracción con calentamiento in situ a microescala para ensayar la evolución de las microestructuras y propiedades de los materiales.
Se usa en microscopio electrónico de barrido y cuenta con algoritmos desarrollados para análisis de EBSD y difracción de rayos X.

Especificaciones de la platina micro de calentamiento y tracción in situ B2-01-35-150-7009	
Platina de tracción	
Carga	Rango opcional:20N□100N□200N□500N□1000N□2000N
	Exactitud a fondo de escala:±0,1%
	Resolución de carga:0,01N
Desplazamiento	Desplazamiento máximo:30mm
	Exactitud a fondo de escala:±0,1%
	Resolución de desplazamiento:100nm
Modo de carga	Ensayo de tracción a velocidad de deformación constante
Velocidad de carga	Ajustable de forma continua
Potencia	110/220V,50~60Hz,48W
Dimensiones del instrumento	148,5 mmx133mmx44,5mm
Peso del instrumento	≈2,0 kg
	Rango de tamaño:l=16-60mm,w_{max}=12mm,t_{max}=4mm
	Tamaño típico:l=48mm,w=6mm,t=1,5mm
Tamaño de la muestra	Área de observación in situ:l=2mm,w=1,5mm,t=1,2mm
Platina de calentamiento (opcional)	
Temperatura de calentamiento	T_{max}=1000℃,±1℃,Área de calentamiento:φ6mm
Potencia	DC,24W
Dimensiones del instrumento	24mmx32mmx40mm
Velocidad de calentamiento	0~50℃/min

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Software de control	
Sistema operativo	Windows 7
Frecuencia de muestreo	0~10Hz
Curva en tiempo real	Carga-desplazamiento, esfuerzo-deformación, temperatura-tiempo
Parámetros en tiempo real	Carga, desplazamiento, esfuerzo, deformación, temperatura
Informe de salida	(Carga, desplazamiento, esfuerzo, deformación, temperatura)-Tiempo
Tipo de informe	Excel

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización